

適用規格							
定 格	使用温度範囲	-35℃～ +85℃（注1）		保存温度範囲		-10℃～ +60℃（注3）	
	使用湿度範囲	20% ～ 80%（注2）		保存湿度範囲		40% ～ 70%（注3）	
	適合コネクタ	DF57H-4S-1.2C(##) DF57AH-4S-1.2C(##)		UL・ C-UL 定格 	使用温度範囲	-35℃～ +75℃（注1）	
	適合端子	DF57-****SCF(##)			電 圧	AC/DC 29V	
	電 圧	AC/DC 50V			電 流	AWG26～28：1.5A/pin AWG30～34：1.0A/pin	
	電 流	AWG26～28：1.5A/pin AWG30：1.0A/pin AWG32：0.8A/pin AWG34：0.5A/pin					
性 能							
		試 験 方 法		規 格		QT	AT
構 造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。		図面と合致していること。		○	○
	表示	目視にて確認する。				○	○
電 氣 的 性 能	低電圧, 低電流下の接触抵抗	20mV 以下, 1 mA (DC又は 1000 Hz) で測定する。		10 mΩ 以下		○	—
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。		100 MΩ 以上		○	—
	耐電圧	AC 500 Vの電圧を 1 分間印加する。		せん絡・絶縁破壊がないこと。		○	—
機 械 的 性 能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。		①接触抵抗: 20 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—
	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。		差込力 24.0 N以下 引抜力 1.2 N以上		○	—
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。		①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。		①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。 (室温に1～2時間放置後測定)		①接触抵抗: 20 mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 100 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—
	温度サイクル	温度 -55 → 85℃ 時間 30 →30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し変えは時間は2～3分 (室温に1～2時間放置後測定)		①接触抵抗: 20 mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 100 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—
	はんだ耐熱性	【リフローはんだ付けの場合】 以下の温度条件で2回のリフローを行う。 リフロー部: ピーク温度250℃ 10秒以内 220℃以上 60秒以下 予熱部: 150～180℃ 90～120秒 【手はんだの場合】 はんだごて温度 350±10℃、3秒の条件にてはんだ付けを行う。 但し、端子に力は加えないこと。		外観の変形及び端子等に著しいガタがないこと。		○	—
	はんだ付け性	はんだ温度 245℃、浸せき時間 5 秒間の はんだ付けを行う。		はんだ浸せき面の95%以上が新しいはんだでぬれていること。		○	—
備考							
(注1) 通電時の温度上昇を含む。							
(注2) 結露のないこと。							
(注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。							
	△の数	訂正記事		設計		検図	年月日
	1	DIS-H-00005763		HK. HAYASHI		SZ. ONO	20200220
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。				承認	KI. AKIYAMA		20120522
				検 図	HK. UMEHARA		20120521
				担 当	TS. KUMAZAWA		20120521
				製 図	MI. SAKIMURA		20120518
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目				図番	SLC-343906-21-01		
	製 品 規 格 表			製品名	DF57H-4P-1.2V(21)		
	ヒロセ電機株式会社			製品コード	CL666-0106-2-21		
					1/1		